

特殊形状試料のSIMS測定

固定方法の工夫により特殊な形状でも分析可能

測定法 : SIMS・チップ固定

製品分野 : 照明・パワーデバイス・LSI・メモリ・電子部品・製造装置・部品

分析目的 : 前処理技術

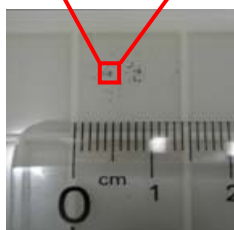
概要

通常、SIMS測定では数mm角で表面が平坦なチップを用いて分析を行いますが、1mm角以下の小さなチップや特殊な形状の試料についても固定の前処理を施すことで分析が可能です。

微量成分を調べたい試料の中には、微小チップやワイヤー状試料など、通常ではSIMS分析には適さない形状のものが 있습니다(図1)。このような試料では固定を行った後に分析を行います(図2)。他にも試料の断面や側面、特殊な形状の試料においても前処理を施すことで分析が可能となる場合があります。

データ

①微小チップ



②ワイヤー状試料

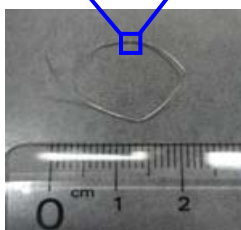
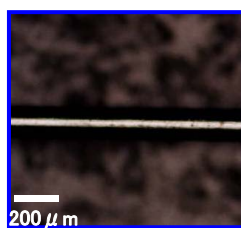


図1 サンプル固定例写真

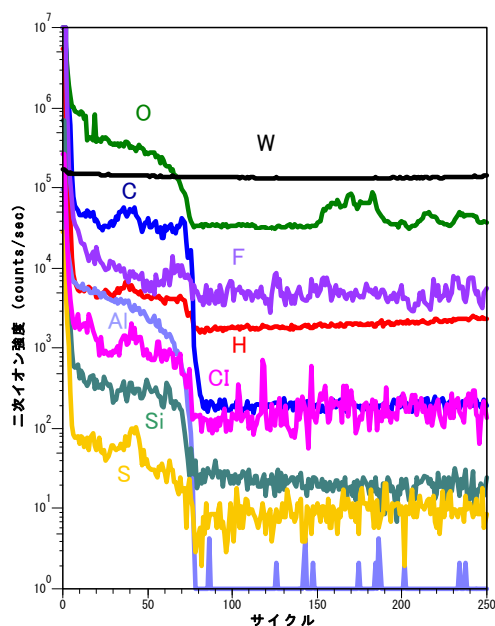


図2 ワイヤー状試料表面からのSIMS分析結果

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>